

ЗОННАЯ СТРУКТУРА КОРОТКОПЕРИОДИЧНЫХ  
(001)-СВЕРХРЕШЕТОК  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$ 

Полыгалов Ю. И., Поплавной А. С.

По методу эмпирического псевдопотенциала с учетом спин-орбитального взаимодействия проведен расчет зонной структуры (ЗС) (001)-сверхрешеток (СР)  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=1, 2, \dots, 12$ ) в центре  $(0, 0, 0)$  и в боковой точке  $(2\pi/a, 0, 0)$  зоны Бриллюэна (ЗБ) СР. Показано, что СР  $(\text{AlAs})_{12}(\text{GaAs})_{12}$  является прямозонной — дно зоны проводимости и вершина валентной зоны происходят из центра ЗБ GaAs. СР с  $n=2, 3, \dots, 11$  являются псевдопрямозонными: вершина валентной зоны происходит из центра ЗБ GaAs, а дно зоны проводимости — из  $X_{\xi_x}^e$ -состояния AlAs. Дно зоны проводимости псевдопрямозонных СР в точке  $(2\pi/a, 0, 0)$  ЗБ СР, формируемое в основном состояниями  $X_{\xi_x}^e$  и  $X_{\xi_y}^e$  AlAs, оказывается расположенным выше  $X_{\xi_x}^e$ -дна на величину  $\leq 0.06$  эВ в СР с нечетными  $n$  и на величину  $\leq 0.14$  эВ в СР с четными  $n$ . В СР  $(\text{AlAs}/\text{GaAs})_1$  дно зоны проводимости оказывается в боковой точке ЗБ СР. При этом расстояние от  $X_{\xi_x}^e, y$  до  $X_{\xi_x}^e$ -уровня составляет 0.001 эВ. Показано, что в идеальных СР  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  имеет место немонотонная зависимость ширины запрещенной зоны  $E_g(n)$  от числа  $n$  монослоев. Именно при монотонном убывании  $E_g(n)$  в рядах СР  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  с четными либо нечетными  $n$  имеют место неравенства  $E_g(n) > E_g(n-1)$  при  $n=3, 5, 7, 9, 11$ . Расчет плотности заряда блоховских состояний, проведенный для вершины валентной зоны и дна зоны проводимости, дает картину преимущественной локализации тяжелых дырок в GaAs-слое, а электронов в AlAs-слое для краевонных СР  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=1, 2, \dots, 11$ ) и в GaAs-слое для прямозонной СР  $(\text{AlAs})_{12}(\text{GaAs})_{12}$ . В результате расчета ЗС получены энергии дипольных переходов из валентной зоны в зону проводимости и соответствующие им поляризаационные зависимости. Проведено сопоставление с имеющимися экспериментальными данными.

В настоящее время интенсивно исследуются высококачественные полупроводниковые кристаллы, содержащие чередующиеся слои двух различных полупроводников, т. е. сверхрешетки (СР), получаемые методами молекулярно-лучевой эпитаксии. Особый интерес в силу ряда специфических свойств вызывает система AlAs/GaAs [1]. В данной работе представлены результаты расчета зонного спектра (ЗС) короткопериодичных СР  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=1, 2, \dots, 12$ ), где  $n$  — число монослоев исходных материалов в направлении (001) — ось роста СР. Расчет ЗС  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  проводился по методу псевдопотенциала с эмпирически определенными в [2] атомными формфакторами псевдопотенциалов AlAs и GaAs. Значения формфакторов для векторов обратной решетки СР находились путем сплайн-интерполяции при соответствующей перенормировке на объем элементарной ячейки СР. При этом атомные формфакторы, отвечающие нулевому вектору обратной решетки, полагались равными  $-2/3E_F$  [3], где  $E_F$  — энергия ферми-газа валентных электронов.

Экспериментально установлено, что вершина валентной зоны AlAs лежит ниже вершины GaAs на величину  $\sim 0.40$ – $0.56$  эВ. В нашем расчете эта величина (разрыв зон), как и в [4], принята равной 0.5 эВ. Для обеспечения этого разрыва введена соответствующая поправка в формфакторы, отвечающие нулевому вектору обратной решетки, что учтено при сплайн-интерполяции. Спин-орбитальное взаимодействие учитывалось по методу, предложенному в [5].

Расчет ЗС СР  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  проводился в точках  $(0, 0, 0)$  и  $(2\pi/a, 0, 0)$ , где  $a$  — постоянная решетки композитов, составляющих СР, и был реализован

следующим образом [2]. Псевдоволновая функция  $\psi_{\mu}^{\text{CP}}(\mathbf{q}, \mathbf{r})$  CP разлагалась по собственным функциям  $\varphi_{ns}(\mathbf{k}_i, \mathbf{r})$  псевдогамильтониана сплава  $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}$

$$\psi_{\mu}^{\text{CP}}(\mathbf{q}, \mathbf{r}) = \sum_{i, n, s} A_{ns}^{\mu}(\mathbf{k}_i, \mathbf{q}) \varphi_{ns}(\mathbf{k}_i, \mathbf{r}), \quad (1)$$

где  $\mathbf{q}$  — волновой вектор зоны Бриллюэна (ЗБ) CP;  $\mathbf{k}_i$  — волновой вектор ЗБ сплава  $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}$ , такой, что  $\mathbf{k}_i - \mathbf{q}$  является вектором обратной решетки CP;  $n, s$  — соответственно зонный и спиновый индексы блоховского состояния сплава;  $\mu$  — зонный индекс блоховского состояния CP. При вычислении функций  $\varphi_{ns}(\mathbf{k}_i, \mathbf{r})$  учитывалось  $\sim 100$  плосковолновых спинов. Коэффициенты разложения  $A_{ns}^{\mu}(\mathbf{k}_i, \mathbf{q})$  и энергии  $E_{\mu}^{\text{CP}}(\mathbf{q})$  CP состояний  $\psi_{\mu}^{\text{CP}}(\mathbf{q}, \mathbf{r})$  находились путем прямой диагонализации матрицы CP псевдогамильтониана, построенной в базе функций  $\varphi_{ns}(\mathbf{k}_i, \mathbf{r})$ . Удовлетворительная точность вычисления уровней вблизи вершины валентной зоны CP и соответствующих им CP состояний достигается путем учета в разложении (1) базисных функций  $\varphi_{ns}(\mathbf{k}_i, \mathbf{r})$ , отвечающих зоне тяжелых (HH), легких (LH) дырок и спин-отщепленной (SO) зоне для  $\mathbf{k}_i$  вблизи центра ЗБ сплава. Для расчета уровней и соответствующих им CP состояний вблизи дна зоны проводимости CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  оказалось достаточным учесть бесспиновые состояния  $\varphi_c(\mathbf{k}_i, \mathbf{r})$ , которые в каждой точке  $\mathbf{k}_i$  отвечают первым двум уровням зоны проводимости сплава  $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}$ .

В результате расчета получено, что края энергетических зон CP располагаются в точках  $(0, 0, 0)$  и  $(2\pi/a, 0, 0)$  ЗБ CP и имеют сложное, зависящее от  $n$  устройство.

Вершина валентной зоны CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=1, 2, \dots, 12$ ) находится в центре ЗБ CP. Два верхних уровня  $E_v^{\text{CP}}$  ( $v=HH, LH$ ) валентной зоны аналогичны соответствующим уровням в вершине валентной зоны сплава  $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}$ . Именно уровень  $E_{HH}^{\text{CP}}$  в вершине валентной зоны в основном формируется состояниями тяжелых дырок (HH-подобный уровень) сплава. Уровень  $E_{LH}^{\text{CP}}$ , отстоящий от HH-уровня  $E_{HH}^{\text{CP}}$  на величину  $\leq 0.055$  эВ, формируется в основном состояниями легких дырок (LH-подобный уровень) сплава. Имеющиеся экспериментальные данные [6] находятся в хорошем согласии с этой величиной [0.05 эВ для  $(\text{AlAs})_7(\text{GaAs})_7$  и 0.048 эВ для  $(\text{AlAs})_{10}(\text{GaAs})_{10}$ ]. Следующий уровень  $E_{SO}^{\text{CP}}$  в CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=1, 2, \dots, 6$ ) формируется в основном состояниями спин-отщепленной зоны сплава (SO-подобный уровень) и находится на расстоянии  $\sim 0.3$  эВ. В CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=7, 8, 9$ ) между LH- и SO-уровнями появляется HH-подобный уровень, формируемый в основном состояниями зоны тяжелых дырок сплава по линии  $\Delta$ . В CP с  $n=10, 11, 12$  между HH- и SO-уровнями появляется еще один LH-подобный уровень, формируемый в основном состояниями легких дырок сплава по линии  $\Delta$ . В CP с  $n=12$  за SO-уровнем располагаются сильно смешанные (HH+SO)- и (LH+SO)-подобные уровни.

Зона проводимости CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  имеет сложное устройство, обусловленное особенностями ЗС AlAs и GaAs. С учетом разрыва зон трехкратно вырожденный уровень  $X_{6x, y, z}^c$  на дне зоны проводимости AlAs оказывается расположенным выше дна зоны проводимости GaAs (уровень  $\Gamma_6^c$ ) на величину 0.21 эВ. CP потенциал смешивает в центре ЗБ CP  $X_{6x}^c$  с  $\Gamma_6^c$ - и  $\Delta$ -состояниями сплава при нечетных  $n$  и  $X_{6x}^c$  с  $\Delta$ -состояниями сплава при четных  $n$ . В точке  $(2\pi/a, 0, 0)$  ЗБ CP дно зоны проводимости CP формируется в основном  $X_{6x}^c$ - и  $X_{6y}^c$ -состояниями сплава и его положение определяется расщеплением уровня  $X_{6x, y}^c$  с фалерита CP потенциалом  $V^{\text{CP}}$ . Величина этого расщепления в CP с нечетными  $n$  в основном определяется матричными элементами типа

$$2|\langle X_{6x}^c | V^{\text{CP}} | X_{6y}^c \rangle| \sim \frac{1}{n} \left[ \left| \Delta V^{\text{III}} \left( \frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}, 0 \right) \right| + \left| \Delta V^{\text{V}} \left( \frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}, 0 \right) \right| \right], \quad (2)$$

где  $\Delta V^{\text{III}}$  и  $\Delta V^{\text{V}}$  — разности формфакторов атомных псевдопотенциалов элементов III и V групп в AlAs и GaAs. В CP с четными  $n$  за счет структурного фактора матричный элемент (2) равен нулю, и положение  $X_{6x, y}^c$ -подобного уровня

Теоретические  $E(X_z)$ ,  $E(\Gamma)$  и экспериментальные  $E_{\text{эксп}}(X_z)$ ,  $E_{\text{эксп}}(\Gamma)$  значения энергий дипольных переходов (в эВ) из вершины валентной зоны на  $X_z$ - и  $\Gamma$ -подобные уровни дна зоны проводимости  $CP(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  и соответствующие им квадраты модулей  $M_{\text{вс}}^{(\perp, \parallel)}$  оптических матричных элементов (в ат. ед.).

$n$	$E(X_z)$	$E(\Gamma)$	$E_{\text{эксп}}(X_z)$	$E_{\text{эксп}}(\Gamma)$	$M_{\text{вс}}^{(\perp)}(X_z) \cdot 10^{-4}$	$M_{\text{вс}}^{(\parallel)}(X_z) \cdot 10^{-4}$	$M_{\text{вс}}^{(\perp)}(\Gamma) \cdot 10^{-4}$	$M_{\text{вс}}^{(\parallel)}(\Gamma) \cdot 10^{-4}$
1	2.044 (82.0) 2.313 (72.9)	2.354 (60.3)	1.99 [8] 1.931 [9]	2.06 [8]	286.4 400.6	90.5 111.2	746.3	307.6
2	2.015 (90.4) 2.295 (69.1)	2.187 (62.6)	1.968 [9]	—	28.1 485.0	0.5 9.8	1067.3	20.6
3	2.025 (85.9)	2.227 (13.4) 2.242 (81.0)	2.033 [9] 2.051 [6, 7]	2.12 [6, 7]	46.9	0.0	207.6 1285.3	0.1 0.8
4	1.897 (60.5)	2.017 (23.7) 2.169 (67.2)	1.897 [10] 1.964 [9]	2.07 [10]	5.9	0.0	396.6 1129.7	0.0 0.0
5	1.938 (56.2) 2.064 (40.4)	2.161 (91.9)	—	—	9.4 39.1	0.0	1259.3	0.4
6	1.831 (48.9)	1.892 (9.8) 2.027 (75.6)	1.790 [9]	—	3.4	0.0	167.3 1334.4	0.0 0.4
7	1.880 (45.0) 2.0128 (49.3)	2.062 (22.2) 2.098 (43.9) 2.106 (23.6)	1.880 [6, 7]	1.961 [6, 7]	4.3 41.4	0.0 0.0	336.0 679.0 362.9	0.0 0.1
8	1.789 (44.3)	1.818 (9.0) 1.905 (66.1)	1.80 [11]	1.91 [11]	7.0	0.0	165.3 1301.1	0.0 0.1
9	1.851 (42.2) 1.989 (46.1)	1.944 (2.8) 2.035 (82.9)	—	—	2.5 1.3	0.0 0.0	42.2 1374.1	0.0 0.1
10	1.749 (35.0)	1.761 (14.9) 1.804 (50.3)	—	1.763 [6, 7]	58.9	0.0	310.9 1103.4	0.0 0.0
11	1.822 (41.0)	1.872 (1.4) 1.944 (1.1) 1.957 (11.3) 1.963 (62.4)	—	—	1.9	0.0	23.3 24.5 215.9 1214.7	0.0 0.0 0.0 0.0
12	1.744 (42.1)	1.712 (56.0) 1.759 (4.3)	—	—	29.5	0.0	1390.6 120.7	0.0 0.0

Примечание. В круглых скобках рядом со значениями вычисленных энергий переходов указан вклад (в %) состояний  $X_{6f}$  и  $\Gamma_6$  сплава  $\text{Al}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}$  в  $X_z$ - и  $\Gamma$ -подобные состояния дна зоны проводимости  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  соответствующего.

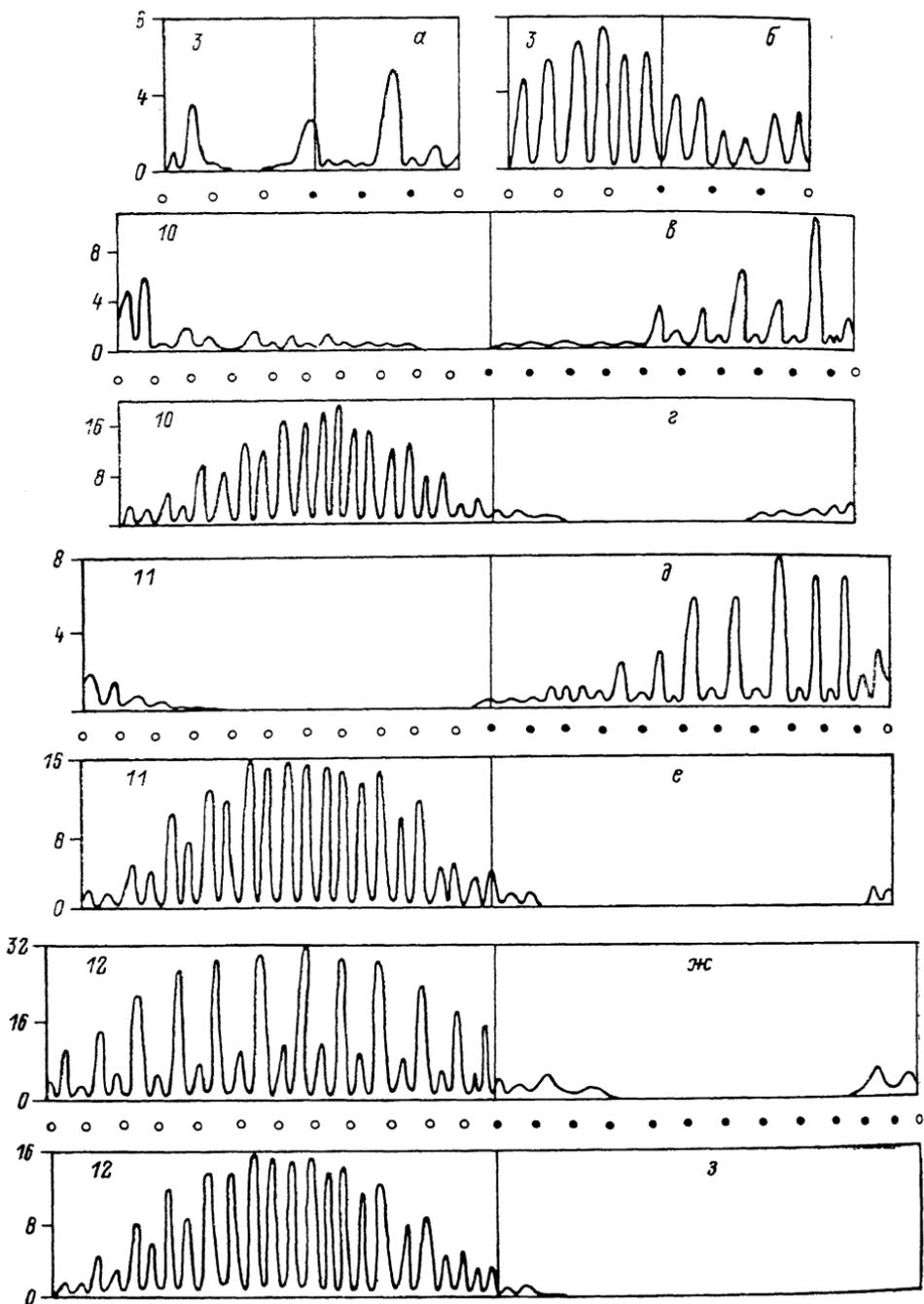
в этом случае определяется смешиванием CP потенциалом  $X_{\beta_x, y}^c$ -состояний сплава с состояниями  $\varphi_c(\Delta', r)$  по линии  $\Delta' = (2\pi/a, 0, 2\pi\mu/a)$  ( $0 < \mu < 1$ ) ЗБ сплава. Используемые в нашем расчете формфакторы на векторе  $(2\pi/a, 2\pi/a, 0)$  дают  $|\Delta V^{\text{II}}| + |\Delta V^{\text{V}}| \sim 0.09$  эВ. Таким образом, согласно оценке (2),  $X_{\beta_x, y}^c$ -уровень сфалерита должен расщепляться на величину  $\sim 0.09/n$  эВ. Точные расчеты подтверждают эту оценку.

В случае CP  $(\text{AlAs})_1(\text{GaAs})_1$   $X_{\beta_x, y}^c$ -подобные уровни оказываются ниже  $X_{\beta_x, y}^c$ -уровня на величину порядка 1 мэВ, и, таким образом, расчет дает для этой CP не прямой край поглощения. В [6, 7] по результатам измерения фотолюминесценции делается вывод о том, что край поглощения в CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  ( $n=1, 2, \dots, 10$ ) является непрямым и дно зоны проводимости этих CP находится в точке  $(2\pi/a, 0, 0)$  ЗБ CP и является  $X_{\beta_x, y}^c$ -подобным. Результаты расчета ЗС  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$  по методу сильной связи [4] также подтверждают этот вывод. Наш расчет согласуется с данными [4, 6, 7] только для случая  $n=1$ . В CP с  $2 \leq n < 12$ , согласно нашим результатам, дно зоны проводимости находится в центре ЗБ CP и формируется в основном  $X_{\beta_x, y}^c$ - и  $\Delta$ -состояниями сплава. Таким образом, на краю поглощения имеют место «псевдопрямые» переходы типа  $\Gamma \rightarrow X_2, \Delta$  сплава. Для CP с  $n=12$  дно зоны проводимости на 53.5 % происходит из уровня  $\Gamma_6^c$ . Таким образом, здесь край поглощения в основном формируется аналогом прямого перехода в сплаве.

Дно зоны проводимости в боковой точке  $(2\pi/a, 0, 0)$  ЗБ CP, формируемое в основном  $X_{\beta_x, y}^c$ -состояниями сплава, оказывается расположенным выше  $X_{\beta_x, y}^c$ -дна на величину  $\leq 0.06$  эВ в CP с  $n=3, 5, 7, 9, 11$  и на величину  $\leq 0.14$  эВ в CP с четными  $n$ . Таким образом, в CP с нечетными  $n$   $X_{\beta_x, y}^c$ - и  $X_{\beta_x, y}^c$ -уровни оказываются гораздо более близкими, чем в CP с четными  $n$ . Причиной этого является отмеченный выше различный характер смешивания CP потенциалом базисных состояний сплава при четных и нечетных  $n$ . Эта же причина приводит к немоноотонной зависимости ширины запрещенной зоны  $E_g(n)$  от числа монослоев в CP  $(\text{AlAs})_n(\text{GaAs})_n$ . Именно при монотонном убывании  $E_g(n)$  в рядах CP с четными либо нечетными  $n$  имеют место неравенства  $E_g(n) > E_g(n-1)$  при  $n=3, 5, 7, 9, 11$ . Имеющиеся экспериментальные значения для  $E_g^{\text{эксц}}(n)$  подтверждают эту особенность (см. таблицу).

Для выяснения характера оптических переходов в CP нами проведен расчет оптических матричных элементов  $M_{v, c}^{\pm, \parallel} = |\langle \psi_{v, c}^{\text{CP}} | P_{\pm, \parallel} | \psi_{v, c}^{\text{CP}} \rangle|^2$  дипольных переходов из верхних уровней валентной зоны на нижние уровни зоны проводимости при параллельной и перпендикулярной поляризациях света по отношению к оси роста CP. В таблице представлены теоретические и экспериментальные значения энергий дипольных переходов из зоны тяжелых дырок на  $X_{\beta_x, y}^c$ - и  $\Gamma_6^c$ -уровни зоны проводимости CP и соответствующие им теоретические значения  $M_{v, c}^{\pm, \parallel}$ . Из таблицы видно, что вычисленные энергии переходов находятся в хорошем согласии с имеющимися экспериментальными данными. Переходы из зоны тяжелых дырок на уровни  $X_{\beta_x, y}^c$  и  $\Gamma_6^c$  для CP с  $n=2-12$  поляризованы преимущественно перпендикулярно оси роста, при этом  $M_{v, c}^{\perp}$  для переходов на уровень  $\Gamma_6^c$  на 1—2 порядка больше соответствующей величины для переходов на уровень  $X_{\beta_x, y}^c$ . Переходы с уровней легких дырок на дно зоны проводимости  $\Gamma_6^c$  поляризованы преимущественно параллельно оси роста CP ( $M_{v, c}^{\parallel} / M_{v, c}^{\perp} \geq \geq 2$ ). В CP с  $n=1$ , где имеет место сильное смешивание  $X_{\beta_x, y}^c$ - и  $\Gamma_6^c$ -состояний сплава CP потенциалом, переходы не имеют резкой поляризационной зависимости.

Далее нами проведен расчет плотностей заряда  $|\psi_{v, c}^{\text{CP}}|^2$  блоховских состояний, отвечающих дну зоны проводимости и вершине валентной зоны CP вдоль связей Ga—As, Al—As, образующих спираль в направлении оси роста CP. Расчет показал, что при  $n=1$  электроны и дырки делокализованы по слоям, а при  $n=2$  намечается слабая локализация дырок в слое GaAs и электронов в слое AlAs, что находится в соответствии с данными [2]. На рисунке представлены результаты расчета  $|\psi_{v, c}^{\text{CP}}|^2$  для  $n=3, 10, 11, 12$ . Видно, что при  $12 > n \geq 3$  имеет место заметная локализация тяжелых дырок в слое GaAs и электронов в слое AlAs. При  $n \geq 12$  тяжелые дырки и электроны дна зоны проводимости (в основном  $\Gamma_6^c$ -уровень) локализованы в слое GaAs.



Зарядовые плотности  $|\psi_{CP}^2|$  (а, в, д, ж) и  $|\psi_{CP}^2|$  (б, г, е, з) (в ед.  $e/\Omega_{CP}$ , где  $e$  — заряд электрона,  $\Omega_{CP}$  — объем элементарной ячейки CP), отвечающие состояниям дна зоны проводимости и вершины валентной зоны CP  $(AlAs)_n(GaAs)_n$  соответственно вдоль связей Ga—As, Al—As, образующих спираль в направлении оси роста CP.

Светлые точки — атомы Ga, темные — Al. Цифры слева — значения  $n$ .

Список литературы

- [1] Sealy B. J. // J. IERE. 1987. V. 57. N 1. P. S2—S12.
- [2] Gell M. A., Ninno D., Taros M., Herbert D. C. // Phys. Rev. B. 1986. V. 34. N 4. P. 2416—2427.
- [3] Хейне В., Коэн М., Уэйр Д. Теория псевдопотенциала. М., 1973. 557 с.
- [4] Ihm J. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 50. N 16. P. 1068—1070.
- [5] Weisz G. // Phys. Rev. 1966. V. 149. N 2. P. 504—518.
- [6] Finkman E., Sturge M. D., Tamargo M. C. // Appl. Phys. Lett. 1986. V. 149. N 19. P. 1299—1301.
- [7] Finkman E., Sturge M. D., Meynadier M. H., Nanory R. E., Tamargo M. C., Hwang D. M., Chang C. C. // J. Luminesc. 1987. V. 39. P. 57—74.
- [8] Van der Ziel J. P., Gossard A. C. // J. Appl. Phys. 1977. V. 48. P. 3018—3023.
- [9] Isu T., Tiang De Sheng, Ploog K. // Appl. Phys. A. 1987. V. 43. P. 75—79.
- [10] Takahashi K., Nayakawa T., Suyama T., Kondo M., Yamamoto S., Mijkata T. // J. Appl. Phys. 1988. V. 63. N 5. P. 1729—1732.
- [11] Danan G., Etienne B., Mollot F., Planel R., Tean-Louis A. M., Alexandre F., Tusserand B., Le Roux G., Marzin T. X., Savary H., Sermage B. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 12. P. 6207—6212.

Кемеровский государственный университет

Получена 21.06.1989  
Принята к печати 16.10.1989